## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 08227910 A

(43) Date of publication of application: 03.09.96

(51) Int. CI

H01L 21/60

(21) Application number: 07030675

(22) Date of filing: 20.02.95

(71) Applicant:

ALPS ELECTRIC CO LTD

(72) Inventor:

SAITO TATSUYA OKADA EIJI IWATA MASANORI

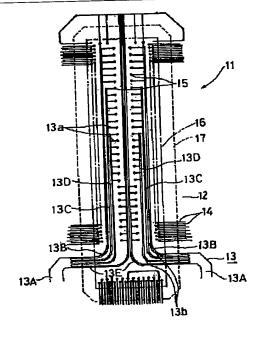
## (54) ELECTRODE PATTERN OF FILM CARRIER

#### (57) Abstract:

PURPOSE: To obtain an electrode pattern of film carrier for stabilizing the connection of a semiconductor device.

CONSTITUTION: A common electrode 13 to be connected electrically with a semiconductor device 16 is composed, at least partially, of a set of a plurality of conductors 13B, 13C, 13D, 13E. Flow out of molten solder is prevented by decreasing the width of unit common electrode 13 and the thermal capacity thereof is also reduced.

COPYRIGHT: (C)1996,JPO



## (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

### (11)特許出願公開番号

# 特開平8-227910

(43)公開日 平成8年(1996)9月3日

|                           |      |        |            | 技術表示箇所  |
|---------------------------|------|--------|------------|---------|
| (51) Int.Cl. <sup>6</sup> | 識別記号 | 庁内整理番号 | FI         | 汉明汉水园バ  |
| • •                       |      |        | HO1L 21/60 | 301N    |
| HO1L 21/60                | 301  |        |            | 3 1 1 W |
|                           | 211  |        |            | 2114    |

## 審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 4 頁)

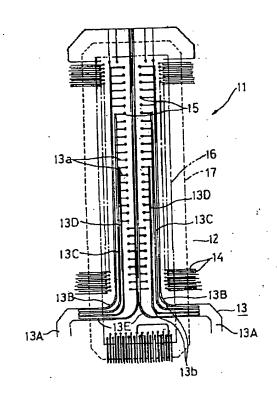
| (21)出願番号 | <b>特顯平7-30675</b> | (71)出願人 000010098<br>アルプス電気株式会社                                     |
|----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| (22)出顧日  | 平成7年(1995) 2月20日  | 東京都大田区雪谷大塚町1番7号<br>(72)発明者 斉藤 達也<br>東京都大田区雪谷大塚町1番7号 アルブ<br>ス電気株式会社内 |
|          |                   | 大電気株式会社内<br>(72)発明者 岡田 英二<br>東京都大田区雪谷大塚町1番7号 アルブ<br>ス電気株式会社内        |
|          |                   | (72)発明者 岩田 征憲<br>東京都大田区雪谷大塚町1番7号 アルブ<br>ス電気株式会社内                    |
|          |                   | (74)代理人 弁理士 中尾 俊輔 (外1名)                                             |

## (54) 【発明の名称】 フィルムキャリアの電極パターン

#### (57)【要約】

【目的】 半導体装置の接続を安定的に行うことのできるフィルムキャリアの電極パターンを提供すること。

【構成】 半導体装置16と電気的に接続される共通電極13の長手方向における少なくとも一部を複数本の導体13B,13C,13D,13Eの集合体により構成し、共通電極13の1本あたりの幅を狭くして、溶融半田の流出を防止するとともに、共通電極13の1本あたりの熱容量を小さくするようにしたもの。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 樹脂フィルム上に金属層を積層してなる フィルムキャリアの電極パターンであって、半導体装置 と電気的に接続される共通電極の長手方向における少な くとも一部を複数本の導体の集合体により構成したこと を特徴とするフィルムキャリアの電極パターン。

1

【請求項2】 前記半導体装置と電気的に接続される部 位の共通電極に複数のボンディングパッドを形成し、こ の複数のボンディングパッドを所定の数ごとのブロック に分割するとともに各プロックをそれぞれ前記複数の導 体のうちの1つに接続したことを特徴とする請求項1に 記載のフィルムキャリアの電極パターン。

【請求項3】 前記導体のコーナー部は滑らかな曲線状 に形成されている請求項1または請求項2に記載のフィ ルムキャリアの電極パターン。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【産業上の利用分野】本発明は、例えばプリンタにおい て往復動されるキャリッジに搭載された印字ヘッドへ駆 動信号を伝達するためにプリンタの制御部とキャリッジ とを接続するように配設される可撓プリント基板などを 形成するためにフィルムキャリアに設けられる電極パタ ーンに係り、特に、半導体装置を実装するためのフィル ムキャリアの電極パターンに関する。

#### [0002]

【従来の技術】このようにLSIのような半導体装置を フィルムキャリアに実装するためには、一般に、フィル ムキャリア上の共通電極および個別電極上に半田バンプ を用いて接続するが、フィルムキャリア上の共通電極に は、個別電極と比較して多くの電流が流れるため、個別 電極と比較して線の太いパターンとして形成されてい

【0003】図2は従来のフィルムキャリアの電極パタ ーンを示すものであり、フィルムキャリア1は、樹脂フ ィルム2上に金属箔からなる共通電極3および個別電極 4, 4…が積層されて構成されている。これらの共通電 極3および個別電極4は、あらかじめ前記樹脂フィルム 2上に全面的に電気的な導体を積層した後にフォトリソ グラフィにより必要個所のみを残すようにエッチングす ることにより形成される。

【0004】このうち、各個別電極4は、相互に先端が 対向するようにして2列にわたって整列配置されてお り、両列の個別電極4、4間の間隙中には個別電極4の 整列方向に延在する共通電極3が配設されている。この 共通電極3の両側には、個別電極に4に対応するように 分岐電極3a,3a…が一体に形成されており、各共通 電極3の分岐電極3aおよび各個別電極4の先端には、 半導体装置(図示せず)との接続を行うためのボンディ ングパッド (図示せず) が形成されている。

【0005】そして、前記共通電極3は、大電流を流す 50 さくすることができる。

必要があるため、各個別電極4と比較して幅広く形成さ れている。・

#### [0006]

【発明が解決しようとする課題】ところで、半導体装置 の実装のために半田バンプを溶融させて半導体装置のボ ンディングを行うと、溶融した半田は電極の幅の広い方 へ流れる傾向があるので、溶融した半田が分岐電極3a のポンディングパッドから共通電極3側に流れ出してし まい、半導体装置の実装に必要な量の半田を確保するこ 10 とができず、半導体装置の接続が不良になってしまうと いう問題点があった。

【0007】また、共通電極3上における溶融した半田 は鋭角なコーナー部に流れる傾向にある。

【0008】さらに、共通電極3と個別電極4とでその 幅が大幅に異なると、半田バンプを溶融させるために加 えた熱が、共通電極3と個別電極4との幅の相違に基づ く熱容量の違いにより、熱容量の大きな共通電極3にお いては半田バンプの溶融に十分に使用されないことにな り、半導体装置の接続が部分的に不十分になるおそれが 20 あった。

【0009】本発明は、前述した従来のものにおける問 題点を克服し、半導体装置の接続を安定的に行うことの できるフィルムキャリアの電極パターンを提供すること を目的としている。

#### [0010]

【課題を解決するための手段】前述した目的を達成する ために、本発明の請求項1に記載のフィルムキャリアの 電極パターンは、樹脂フィルム上に金属層を積層してな るフィルムキャリアの電極パターンであって、半導体装 30 置と電気的に接続される共通電極の長手方向における少 なくとも一部を複数本の導体の集合体により構成したこ とを特徴としている。

【0011】また、請求項2に記載のフィルムキャリア の電極パターンは、請求項1において、前記半導体装置 と電気的に接続される部位の共通電極に複数のボンディ ングパッドを形成し、この複数のボンディングパッドを 所定の数ごとのブロックに分割するとともに各ブロック をそれぞれ前記複数の導体のうちの1つに接続したこと を特徴としている。

40 【0012】さらに、請求項3に記載のフィルムキャリ アの電極パターンは、請求項1または請求項2におい て、前記導体のコーナー部は滑らかな曲線状に形成した。 ことを特徴としている。

#### [0013]

【作用】本発明のフィルムキャリアの電極パターンによ れば、共通電極の長手方向における少なくとも一部を複 数本の導体の集合体により構成したので、共通電極の1 本あたりの幅を狭くして、溶融半田の流出を防止するこ とができるとともに、共通電極1本あたりの熱容量を小

3

【0014】また、複数のボンディングパッドを所定の 数ごとのブロックに分割するとともに各ブロックをそれ ぞれ前記複数の導体のうちの1つに接続することによ り、導体の長さに対応して分担するボンディングパッド の数を変更し、各導体における発熱量および電圧低下を 均一にすることができる。

【0015】さらに、導体のコーナー部を滑らかな曲線 状に形成することにより、コーナー部への溶融半田の溜 まりを防止することができる。

#### [0016]

【実施例】以下、本発明を図面に示す実施例により説明 する。

【0017】図1は本発明の1実施例としてのフィルム キャリアの電極パターンを示すものである。

【0018】本実施例のフィルムキャリア11は、ポリ イミド等の樹脂フィルム11aと、この樹脂フィルム1 1 a 上に積層された銅箔等からなる共通電極 1 3 および 複数の個別電極14とを有しており、このうち、個別電 極14は、図2において説明した従来のものと同様の構 成とされている。すなわち、各個別電極14は、相互に 先端が対向するようにして2列にわたって整列配置され ており、両列の個別電極14,14間の間隙中には個別 電極14の整列方向に延在する後述する共通電極13が 配設されている。また、前記各個別電極14の先端に は、半導体装置 (図示せず) との接続を行うためのボン ディングパッド15が形成されている。

【0019】一方、前記共通電極13は、それぞれ図示 しない電源側と接続されている2本の基部13A,13 Aを有しており、両基部13A,13Aは、一方の列の 端に位置する個別電極4の側方において先端が相互に対 向するように配設されている。前記各基部13Aには、 一方の列の個別電極4に対応するようにしてほぼ平行す るように延在し、相互に間隔を隔てるように形成された 複数本の導体13B, 13C, 13D, 13E…が連設 されている。前記各導体13B,13C,13D,13 E…の幅が、前述した従来の共通電極3の幅より狭く形 成されていることはもちろんである。なお、前記各基部 13Aにおける各導体13B,13C,13D,13E …との分岐点は、加熱領域17の外側とし、各基部13 Aへの熱伝導を低減させるようになっている。

【0020】また、前記各複数本の導体13B,13 C, 13D, 13E…は、それぞれ前記基部13Aから 前記両列の個別電極4、4間の間隙中に臨むように延在 しており、導体13B, 13C, 13D, 13E…のコ ーナー部14は滑らかな曲線状に形成されている。よっ て、各コーナー部14における溶融半田の溜まりを防止 することができる。

【0021】一方の基部13Aから延在する各導体13 B, 13C, 13D, 13E…は、前述したように一方 の列の各個別電極4に対応するようになっているが、各 50 14の熱容量がほぼ等しくなり、半田バンプを溶融させ

導体13B, 13C, 13D, 13E…の幅は相互に異 なっている。これは、前記基部13Aから各導体13 B, 13C, 13D, 13E…の先端までの距離の大小 により通電時の電気抵抗値に差が生じるためであり、通 電時の電気抵抗値を均一にするために、距離の長い導体 13 Bほど幅を広く形成され、距離の短い導体13 Eほ ど幅を狭く形成されている。

【0022】また、前述したように各導体13B,13 C, 13D, 13E…の幅を変化させても、距離の長い 10 導体13Bほど多少電気抵抗値が高くなるため、距離の 長い導体13Bは、距離の短い導体13C,13D,1 3 Eより分担する個別電極4の数を少なくされている。 すなわち、1本の分岐電極13aには4本の個別電極が それぞれ対応しており、距離の一番長い導体13Bの先 端部には、本実施例において24本の個別電極4に対応 する6本の分岐電極13aが一体に形成されており、つ ぎに距離の長い導体13Cの先端部には、本実施例にお いて28本の個別電極4に対応する7本の分岐電極13 aが一体に形成されている。また、つぎに距離の長い導 20 体13Dの先端部には、本実施例において32本の個別 電極4に対応する8本の分岐電極13aが一体に形成さ れており、一番短い導体13Eの先端部には、36本の 個別電極4に対応する9本の分岐電極13aが一体に形 成されている。そして、各分岐電極13aの先端部には ボンディングパッド15が形成されている。

【0023】このように、本実施例においては、各個別 電極4に対応する複数のボンディングパッド15を所定 の数 (本実施例においては6,7,8,9) ごとのブロ ックに分割するとともに各ブロックをそれぞれ前記複数 30 の導体13B,13C,13D,13E…のうちの1つ に導体13B,13C,13D,13E…の長さに応じ て長い導体ほどボンディングパッド15の数が少なくな るように接続したので、各導体13B,13C,13 D, 13E…における発熱量および電圧低下をほぼ均一 にすることができる。

【0024】前述した実施例によれば、共通電極13 は、電源側と接続されている2本の基部13A,13A から延在する部位を相互に離間している複数本の導体1 3B, 13C, 13D, 13E…により構成したので、

40 各導体13B,13C,13D,13E…の幅を従来の 共通電極3より細く形成することができる。 したがっ て、半導体装置の実装のために半田バンプを溶融させて 半導体装置のボンディングを行う場合にも、溶融した半 田が分岐電極13aのボンディングパッド15から共通 電極13の各導体13B,13C,13D,13E…側 に流れ出すことがなく、半導体装置の接続を確実に行う ことができる。

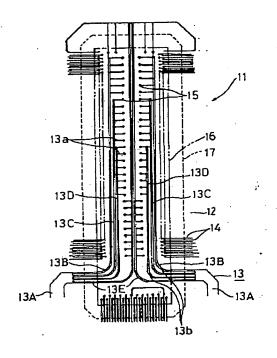
【0025】また、共通電極13と個別電極14とでそ の幅がそれほど異ならないため共通電極13と個別電極 5

るために加えた熱が、共通電極13と個別電極14とに 均等に配分されることになり、個別電極14のいずれに おいても半田バンプの溶融が十分に行われ、この点にお いても半導体装置の接続を確実に行うことができる。

【0026】また、共通電極13の各導体13B,13C,13D,13E…の幅を変化させ、しかも、各個別電極4に対応する複数のポンディングパッド15を所定の数ごとのブロックに分割するとともに各ブロックをそれぞれ前記複数の導体13B,13C,13D,13E…のうちの1つに導体13B,13C,13D,13E…の長さに応じて長い導体ほどボンディングパッド15の数が少なくなるように接続したので、各導体13B,13C,13D,13E…における発熱量および電圧低下をほぼ均一にすることができる。

【0027】なお、本発明は前記実施例に限定されるものではなく、必要に応じて変更することができる。

【図1】



[0028]

【発明の効果】以上説明したように本発明のフィルムキャリアの電極パターンによれば、フィルムキャリアとしての機能を損なうことなく、半導体装置の接続を安定的に行うことができるという効果を奏することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係るフィルムキャリアの電極パターン の実施例を示す平面図

【図2】従来のフィルムキャリアの電極パターン構造を 10 示す平面図

【符号の説明】

11 フィルムキャリア

13 共通電極

13A 基部

13B, 13C, 13D, 13E 導体

14 コーナー部

【図2】

